



Ref. Certif. No.

DE 3 - 3999

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

**CB TEST CERTIFICATE
CERTIFICAT D'ESSAI OC**Product
ProduitMicroscopes
(IVD equipment)Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeurLeica Microsystems CMS GmbH
Ernst-Leitz-Straße 17-37
35578 Wetzlar, GERMANYName and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricantLeica Microsystems CMS GmbH, Ernst-Leitz-Straße 17-37, 35578
Wetzlar, GERMANYName and address of the factory
Nom et adresse de l'usineLeica Microsystems Ltd. Shanghai, 258, Jin Zang Road, Building
1, Jinqiao Export Processing Zone, 201206 Shanghai, PEOPLE'S
REPUBLIC OF CHINARatings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principalesRated Voltage: 100-240 VAC
Rated frequency: 50/60 Hz
Rated power: 18 VA
Protection class: I
Lamp classification group: exempt groupModel/type Ref.
Ref. de type

DMI1

Additional information (if necessary)
Information complémentaire (si nécessaire)A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à laIEC 61010-1(ed.3)
IEC 61010-1(ed.2)
IEC 61010-2-101(ed.1)as shown in the Test Report Ref. No.
which forms part of this certificate
comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro
de référence qui constitue une partie de ce
certificat

028-713061172-000

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme **National de Certification**Date, 2015-05-12
CB 15 05 56257 112

Ralph Fischer



TÜV SÜD Product Service GmbH · Certification Body · Ridlerstrasse 65 · D-80339 München

Product Service